

# RFテストの基礎セミナー開催のご案内

- RFテスターによるRFデバイスの回路網解析 -



IoT(Internet of Things)の時代を迎え、RF(無線周波数)回路が組み込まれた半導体の設計・開発・製造が盛んになっています。それに伴って新たにRFデバイスのテストに携わる人が増えていくと思われます。RF領域ではテスト信号波長が非常に短いために、信号波長に対してテスター・デバイス間の配線長が無視できなくなり、低い周波数で実施してきたような電圧電流測定が通用しなくなります。RF信号においては線路のインピーダンス整合が非常に重要になり、Sパラメータ理論に基づく入出力ポートの入射波、反射波、透過波をとらえて比を評価する回路網解析をしてデバイスをテストするという手法がとられます。このセミナーでは回路網解析を中心としたRFテスターにおける信号の分離方法、代表的なテスト項目とそのテスト法など、RFテストの基礎的な考え方を解説します。RF通信で行われているデジタル変復調にも簡単に触れます。これからRFテスターの新規導入を検討される方、あるいはRFテストに携わろうとするテストエンジニア、アプリケーションエンジニアの方々など、この機会に本セミナーの受講をご検討下さい。

## ◎ 開催日時

7月14日(金) 14:00 ~ 17:00

- ・ 約3時間の講義
- ・ 質疑応答

17:30 ~ 懇談会(参加希望者のみで)

## ◎ 開催場所

株式会社 EVALUTO セミナー室 (ATEサービス内)  
〒194-0005 東京都町田市南町田5丁目6番23号  
電話番号 : 042-795-8607

東急田園都市線 南町田駅 下車 徒歩 8分

<https://evaluto.co.jp/company/>

## ◎ 参加費

15,000円(税別) (16,200円(税込))

## ◎ 受講対象者

- ・ RFデバイスのテストにこれから携わろうとするエンジニアの方
- ・ RFテスターの仕組み、RFデバイス・テストについて学びたい方

# RFテストの基礎セミナー開催のご案内

- RFテスターによるRFデバイスの回路網解析 -



## ◎ セミナー内容

1. RFの特徴
2. Sパラメータ
3. 入射波、反射波、透過波の分離
4. RFデバイスの評価
5. 代表的なテスト項目
6. RFテストに使用する部品とRFテスター構成
7. RFインピーダンス測定用方向性ブリッジと誤差補正
8. TDR実験
9. デジタル変復調
10. 全体のまとめ

## ◎ 講師は、弊社のビジネスパートナーである 大河原秀雄 氏が担当します。

(大河原氏の経歴：横河ヒューレット・パカード、Agilent、Verigy、アドバンテストを経て、現在、ATEサービス 上級コンサルタント)

## ◎ 申し込み方法について

- ・ 株式会社 EVALUTOのホームページの「セミナー申込」から、申し込みをして下さい。  
<https://evaluto.co.jp/business/seminar/>
- ・ 株式会社 EVALUTOに、お問い合わせ・ご連絡をして下さい。  
電話番号：042-795-8607
- ・ 株式会社 EVALUTO 佐々まで、お問い合わせ・ご連絡をして下さい。  
Mobile：090-3247-8495

## ◎ 注意事項

- ・ 受講者が最低開催可能人数に達しない場合、開催をキャンセルさせて頂く場合があります。予めご了承を願います。

本資料に掲載されている商品またはサービス等の名称は、各社の商標または登録商標です。

